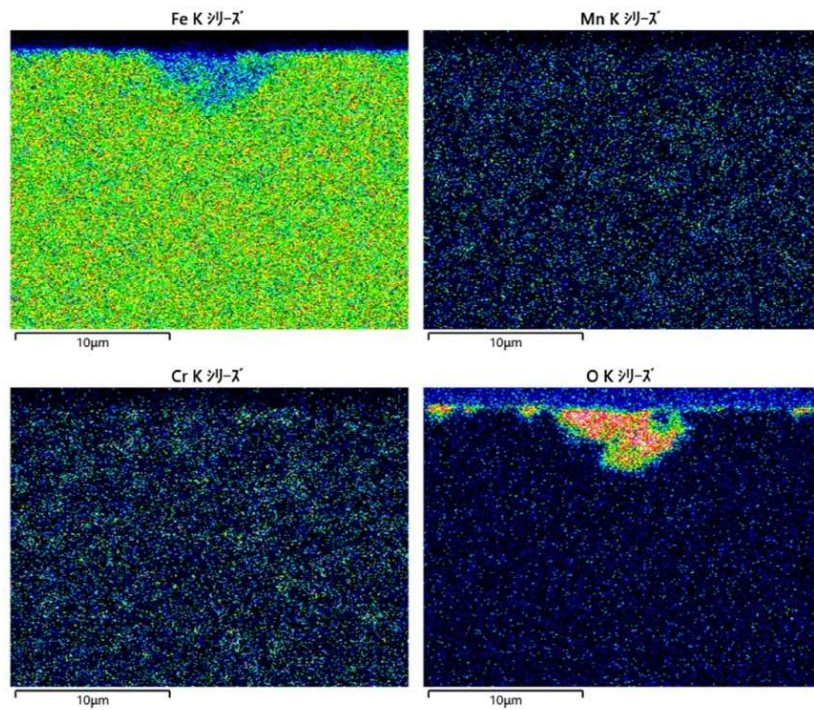
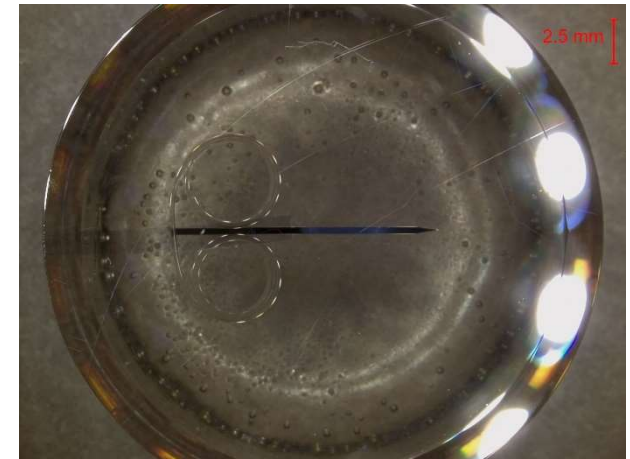


観察サンプル：カッター腐食部



SAITEC  
カッター 腐食部



図：カッター（樹脂包埋）のマイクロスコープ画像  
※『分析走査電子顕微鏡（SEM-EDX）による分析（マッピング）』の成績書にマイクロスコープ画像は付属しません。

図：分析走査電子顕微鏡（SEM-EDX）のカラーマップ（成績書別紙）